

研究简报

发射光谱法测定二氧化碲中的杂质元素

赵秀岩

原子高科股份有限公司

收稿日期 2006-10-23 修回日期 2007-4-4 网络版发布日期: 2007-6-29

摘要 : 采用发射光谱粉末法同时测定二氧化碲Pb、Mn、Ba、Sn、Fe、Co、Ti、Cd、Cr、Al、Ca、Si、B、Bi、V、Ni、Sb、Zn、Ag、Mg、Cu 18个金属元素, 选择石墨作载体, 直接压样于石墨电极中, 简单, 快速而准确。其回收率在80%-120%范围内, 相对标准偏差小于8%, 用于样品的测定取得了满意的结果。

关键词 [发射光谱法](#) [二氧化碲](#) [杂质元素](#)

分类号

Determination of Eighteen Trace Impurities in Tellurium Oxide by Atomic Emission Spectrometry

Abstract : This paper describes the determination of the determination of trace Pb、Mn、Ba、Sn、Fe、Al、etc in tellurium oxide by atomic emission spectrometry (AES)。The sample was directly loaded into ordinary electrode。The method is simple, rapid and accurate。The range of the recovery is 83%-124%, and relative standard (RSD) is smaller than 8%。The method has been applied to the determination of the sample with satisfactory results。

Key words [Atomic emission spectrometry](#) [Tellurium oxide](#) [Impurity Element](#)

DOI

通讯作者 赵秀岩 xyzh401@sohu.com

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(171KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“发射光谱法”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [赵秀岩](#)